

東京工業高等専門学校受託試験取扱規則

制 定 平成 7年 8月 31日

最終改正 令和 3年 11月 4日

(目的)

第1条 東京工業高等専門学校（以下「本校」という。）において、学外からの依頼に応じて行う試験、分析、鑑定等（以下「受託試験」という。）の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構受託試験取扱規則（平成16年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第48号）又は別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(受託試験の試験料)

第2条 受託試験に係わる基準料金は、別表のとおりとする。

(受託試験の実施窓口)

第3条 受託試験の実施窓口は、産業技術センターとする。

(受託試験の依頼)

第4条 受託試験を依頼しようとする者（以下「依頼者」という。）は、受託試験依頼書（別紙第1号様式）により、総合教育支援センター長（以下「センター長」という。）を経て、校長に提出しなければならない。

(受託試験の決定)

第5条 センター長は、前条の受託試験の依頼があったときは、受託試験の実施の可否、試験料金及び当該受託試験を担当する教員等の意見を付して、受託試験依頼書を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項により提出があった場合は、本校の教育研究上有意義であり、かつ教育研究に支障が生じるおそれがないと認めた場合に限り、受託を決定する。

3 校長は、当該受託試験を受託したときは、受託試験承諾書（別紙第2号様式）を依頼者に交付する。

(試験料の納入)

第6条 受託試験を承諾された依頼者は、本校が定める試験料金を納入しなければならない。

2 納入された試験料金は、返還しない。

(受託試験の結果の通知)

第7条 校長は、受託試験担当者からセンター長を経て、受託試験の結果の報告を受けたときは、その受託試験の結果を受託試験成績表（別紙第3号様式）により、依頼者に通知するものとする。

(試料の処理)

第8条 依頼者が提出した試料は、原則としてこれを返還しないものとする。ただし、試験後の残りの試料を返還する場合は、返還に要する費用を依頼者が負担するものとする。

(不可抗力による試料の損害)

第9条 不可抗力によって生じた試料の損害に対し、本校はその責を負わないものとする。

(受託試験の事務)

第10条 受託試験の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。

附則

この規則は、平成7年8月31日から施行する。

附則

この規則は、平成9年6月12日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附則

この規則は、平成13年1月25日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

附則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成21年10月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則

この規則は、平成29年6月7日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則

この規則は、平成31年1月9日から施行する。

附則 (令和3年3月24日 一部改正)

この規則は、令和3年3月24日から施行する。

附則 (令和3年11月4日 一部改正)

この規則は、令和3年11月4日から施行する。

受託試験依頼書

年 月 日

東京工業高等専門学校長 殿

依頼者(※)	ふりがな 会社名 ふりがな 所属（役職）・氏名 住所 連絡先（電話・FAX）
請求書等送付先 (会計担当責任者)	ふりがな 所属（役職）・氏名 (住所：依頼者と異なるとき) (事業所名：依頼者と異なるとき) () 連絡先（電話・FAX）

※ 個人の依頼者は、会社名は不要です

※ 氏名・連絡先が同じ場合は、「同上」として下さい

試験の種類	a.試験 b.分析 c.鑑定 d.その他 ()
現品名	
現品の形状及び数量	
試験の目的	
備考	

受託試験承諾書

年 月 日

依頼者住所
氏名又は名称

殿

東京工業高等専門学校長

印

年 月 日付けで依頼のあった受託試験を下記のとおり承諾します。

記

試験料金	円
試験担当者	学科名： 役職： 氏名：

受託試験成績表

年 月 日

依頼者住所
氏名又は名称

殿

東京工業高等専門学校長

印

年 月 日付で依頼のあった受託試験の結果は、下記のとおりです。

記

試験の種目	a.試験 b.分析 c.鑑定 d.その他 ()
現品名	
現品の形状 及び数量	
試験担当者氏名 試験年月日	学科 職名 氏名 年 月 日
試験結果	別紙のとおり
備 考	

受託試験料金

設備	試験の内容	本校の料金	
ESCA (XPS) - 光電子分光分析装置	試料の分析	1 試料 1 視野	17,000 円
		1 視野増す毎に	2,000 円
		深さ方向分析	28,000 円～
X 線回折装置	試料の分析	測定のみ 1 試料あたり	9,000 円
		定性分析 1 試料あたり	12,000 円
走査型電子顕微鏡 (電界放射型走査型電子顕微鏡)	顕微鏡写真 定性・半定量 分析	1 試料あたり (基本料金)	13,000 円
		写真 1 枚あたり	5 万倍未満 : 1,000 円/枚 5 万倍以上 10 万倍未満 : 1,500 円/枚 10 万倍以上 30 万倍未満 : 2,000 円/枚 30 万倍以上 (100 万倍まで) : 3,000 円/枚
		定性・半定量分析 1 件あたり	点分析 (定性・半定量) : 6,000 円 線/面分析 (定性・半定量、マッピング) : 15,000 円
		その他オプション測定	・加熱観察 : 加熱試料台使用料 30,000 円/日 ・加熱試料台るつぼ (消耗した場合 2 個目以降実費として) : 25,000 円/個 ・冷却・調湿観察 : 冷却試料台使用料 30,000 円/日 ・動画撮影 : 10,000 円/1 件 ・データ引き渡しメディア (DVD-R) 代 : 基本料を含む
		※試料数による基本料金と、測定種類による加算制となります	依頼者が立会う場合 20,000 円/hr (試料数・撮影数にかかわらず。加熱・冷却試料台使用料は別途請求)
ICP 発光分光分析試験	試料の分析	1 試料あたり	13,000 円
有機溶媒系サイクリックボルタンメトリー測定	試料の分析	1 試料あたり	37,000 円
		1 条件追加ごと	4,000 円
核磁気共鳴装置	試料の分析	1 試料あたり (条件 : 液体, ^1H)	14,000 円
	試料の分析	1 試料あたり (条件 : 液体, ^{13}C または 2 次元)	20,000 円
高速液体クロマトグラフ	試料の分析	1 試料 (1 成分) あたり	20,000 円

回転リングディスク電極による試料評価	試料の分析	1 試料あたり	17,000 円
		1 条件追加ごと	4,000 円
		その他追加費用 (依頼者で準備しない場合)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電解液 電解質や溶媒の種類に応じた価格 (要相談) ・ 試料インク調製 1,100 円/1 サンプル ※インク化しにくいサンプルもあるので要相談